

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DE ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E
QUALIDADE, ASSISTENTE EXECUTIVO EM METROLOGIA E QUALIDADE, PESQUISADOR-TECNOLOGISTA
EM METROLOGIA E QUALIDADE E TÉCNICO EM METROLOGIA E QUALIDADE
EDITAL Nº 16 – INMETRO, DE 20 DE ABRIL DE 2011

O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO), em razão da revisão na avaliação de títulos da candidata Emile Santos Barrias, inscrição nº 10020811, motivada pela decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 16784-86.2011.4.01.3400, em andamento na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, torna pública a **retificação no subitem 1.2.30 do resultado final na avaliação de títulos e experiência profissional**, divulgado no Edital nº 13 – INMETRO, de 25 de fevereiro de 2011 e no **subitem 2.2.30 do resultado final do concurso**, divulgado no Edital nº 15 – INMETRO, de 1º de abril de 2011, publicados no *Diário Oficial da União*, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

1 Resultado final na avaliação de títulos e experiência profissional, na seguinte ordem: cargo/área/localidade de vaga, número de inscrição, nome da candidata em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos e experiência profissional.

(...)

1.2.30 PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE – ÁREA: METROLOGIA APLICADA À MICROSCOPIA ÓPTICA – RIO DE JANEIRO

10016725, Cecilia Stahl Vieira, 0.00 / 10026707, Celio Jose de Castro Junior, 7.00 / 10020811, Emile Santos Barrias, 7.00 / 10014928, Fernando Pereira de Almeida, 13.00 / 10017681, Ivanildopedro de Sousa Junior, 9.00.

(...)

2 Resultado final do concurso na seguinte ordem: cargo/área/localidade de vaga, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota e classificação final no concurso.

(...)

2.2.30 PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE – ÁREA: METROLOGIA APLICADA À MICROSCOPIA ÓPTICA – RIO DE JANEIRO

10016725, Cecilia Stahl Vieira, 66.14, 5 / 10026707, Celio Jose de Castro Junior, 73.24, 4 / 10020811, Emile Santos Barrias, 81.29, 1 / 10014928, Fernando Pereira de Almeida, 80.63, 2 / 10017681, Ivanildopedro de Sousa Junior, 76.59, 3.

(...)

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
Presidente do Inmetro